

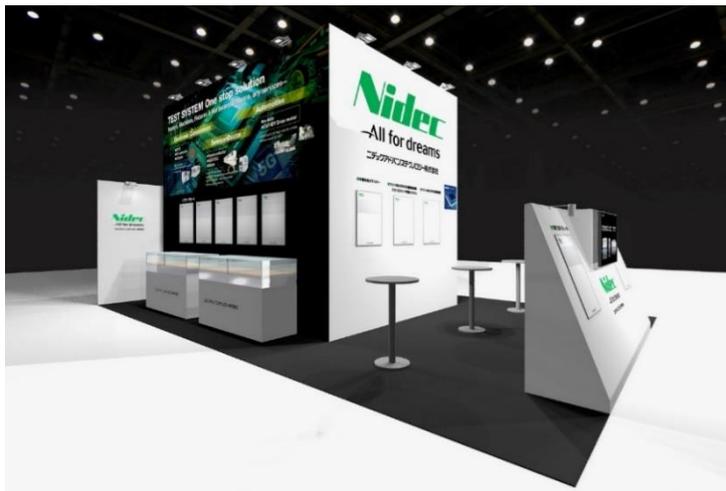
2024年11月20日

各位

会社名 ニデックアドバンステクノロジー株式会社  
代表者名 代表取締役社長 山崎 秀和  
所在地 京都府向日市森本町東ノ口1-1  
ニデックパークC棟

## SEMICON Japan 2024 出展について

ニデックアドバンステクノロジー株式会社（以下、当社）は、2024年12月11日(水)～12月13日(金)に東京ビッグサイトで開催される「SEMICON Japan 2024」に出展します。



今回の展示会では、IGBT/SiC 向けパワー半導体検査装置や EV/HEV 等の駆動モータ用テストベンチ、Wafer 検査用治具「プローブカード」等の最新ソリューションを出展いたします。

当社の核となる「はかる」ことを体現してきた、半導体パッケージ基板電気検査システム「GATS シリーズ」や微小バンプを2D/3D 計測する光学式検査装置も併せて紹介いたします。

これまで培ってきた検査技術をベースに、最新の検査ソリューションと未来に貢献する新製品・新技術を提案いたします。

### 〈出展概要〉

- ・会期：2024年12月11日(水)～12月13日(金)
- ・会場：東京ビッグサイト 東展示棟
- ・ブース：2Hall 2011
- ・公式サイト：<https://www.semiconjapan.org/jp/>

### 〈出展内容〉

- ・IGBT/SiC モジュール向け絶縁/静特性/動特性検査装置「NATS-1000/1700 シリーズ」
- ・EV 駆動モータ用テストベンチ「TDAS シリーズ」
- ・ウエハバンプ自動検査システム「RWi シリーズ」
- ・半導体パッケージ基板電気検査システム「GATS シリーズ」
- ・AC/DC マルチテスター「R-700 シリーズ」
- ・半導体 Wafer 検査用プローブカード
- ・超高精度検査用ピンプローブ
- ・KGD テスト装置「NATS-1300 シリーズ」
- ・パワー半導体モジュール用動的信頼性試験装置「NATS-8000 シリーズ」
- ・リファレンスインバーター
- ・3D 光学検査装置「NSW シリーズ」